

Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Specifikace a měřicí metody

ČSN
EN 62276
ed. 2
35 8417

idt IEC 62276:2012

Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications – Specifications and measuring methods

Tranches monocristallines pour applications utilisant des dispositifs a ondes acoustiques de surface (OAS) –
Spécifications et méthodes de mesure

Einkristall-Wafer für Oberflächenwellen-(OFW-)Bauelemente – Festlegungen und Messverfahren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62276:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62276:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-11-23 se nahrazuje ČSN EN 62276 (35 8417) z července 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Přejímaná norma se týká výroby orientovaných monokrystalických desek ze syntetického křemene, lithium niobátu (LN), lithium tantalátu (LT), lithium tetraborátu (LBO) a lanthan gallium silikátu (LGS). Tyto monokrystalické desky se používají jako substráty při výrobě rezonátorů a filtrů s povrchovou akustickou vlnou (PAV).

Norma stanovuje specifikaci požadavků na materiál a na desky, které jsou z něho vyrobeny. Dále jsou uvedeny metody zkoušení jednotlivých parametrů monokrystalických desek, včetně geometrie a defektů povrchu, inkluzí, mřížkové konstanty, krystalové orientace a další. Jsou rovněž uvedeny metody vizuální kontroly, identifikace, značení, balení a dodací podmínky pro tyto desky.

V závěru normy jsou v normativní příloze uvedeny definiční vztahy pro Eulerovy úhly, které určují krystalovou orientaci desek. Pro informaci jsou potom v dalších přílohách stručně popsány metody pěstování syntetických krystalů a standardní technologický postup výroby desek pro součástky s PAV.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62276:2013 dovoleno do 2015-11-23 používat dosud platnou ČSN EN 62276 (35 8417) z července 2006.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy obsahuje následující významné technické změny:

- termíny a definice jsou seřazeny podle abecedního pořadí;
- do kapitoly Termíny a definice se doplňuje termín „redukovaný LN“;
- do kapitoly Termíny a definice se doplňuje termín „redukovaný LT“;
- do kapitoly Termíny a definice se doplňuje termín „redukční proces“.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60410:1973 nezavedena

IEC 60758:2008 zavedena v ČSN EN 60758 ed. 2:2009 (35 8416) Krystaly syntetického křemene – Specifikace a pokyny k použití

Informativní údaje z IEC 62276:2012

Mezinárodní normu IEC 62276 vypracovala technická komise IEC/TC 49 *Piezeelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a přidružené materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci*.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2005. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS	Zpráva o hlasování
49/1005/FDIS	49/1011/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (<http://webstore.iec.ch>) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

- znovu potvrzena;
- zrušena;
- nahrazena revidovaným vydáním, nebo
- změněna.

DŮLEŽITÉ Logo „colour inside“ na titulní straně této publikace znamená, že publikace obsahuje barevné značení, které se považuje za užitečné pro správné pochopení jejího obsahu. Uživatelé by proto měli tisknout tento dokument na barevné tiskárně.

Související ČSN

ČSN EN 60862 (soubor) (35 8450) Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

ČSN EN 61019 (soubor) (35 8450) Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Josef Suchánek, CSc., IČ 63237261

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.